

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) | [Publications/Services](#) | [Standards](#) | [Conferences](#) | [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore**
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [See](#)**Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ [Home](#)
- ☐ [What Can I Access?](#)
- ☐ [Log-out](#)

Tables of Contents

- ☐ [Journals & Magazines](#)
- ☐ [Conference Proceedings](#)
- ☐ [Standards](#)

Search

- ☐ [By Author](#)
- ☐ [Basic](#)
- ☐ [Advanced](#)

Member Services

- ☐ [Join IEEE](#)
- ☐ [Establish IEEE Web Account](#)
- ☐ [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)Your search matched **92** of **945031** documents.A maximum of **92** results are displayed, **15** to a page, sorted by **Relevance** in **descending** order.
You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text box.Then click **Search Again**.

((pose <or> position) <near/2>(extract* <or> recogni* <o

[Search Again](#)**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****91 Geometric probing of dense range data***Greenspan, M.A.;*Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on , Volume: 24 I
4 , April 2002

Page(s): 495 -508

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(1072 KB\)\]](#) **IEEE JNL****92 An ASIC for Hartmann-Shack wavefront detection***Droste, D.; Bille, J.;*

Solid-State Circuits, IEEE Journal of , Volume: 37 Issue: 2 , Feb. 2002

Page(s): 173 -182

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(496 KB\)\]](#) **IEEE JNL**[\[Prev\]](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#)[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved